……
(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ
Nr postępowania: ZP/259/050/D/11

Opis oferowanej dostawy
OFERUJEMY:

1) Mikroskop AFM według pkt 1 a) załącznika nr 7 do SIWZ, model / producent ……..……
……

Detekcja ugięcia sondy wiązką lasera		TAK/ NIE	
Mikroskopia sił atomowych w trybie statycznym i rezonansowo drgającą belką		TAK/ NIE	
Zakres skanowania w kierunku XY		……. um x ……um	
Zakres skanowania w kierunku Z		…….. um	
Układ obserwacji dźwigni AFM i powierzchni próbki			
Cyfrowa Kamera CCD pozwalająca na wyświetlanie obrazu na monitorze komputera sterującego mikroskopem		TAK/ NIE	
Podstawowe parametry komputera			
Kompatybilny komputer		Producent	Parametry
Monitor			
Klawiatura			
Myszka			
Procesor			
Dysk twardy			
Pamięć operacyjna			
Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu, zapewniające obróbkę, opracowywanie i prezentację danych pomiarowych, pracujące pod systemem Windows	Tak / Nie		Funkcje:
Dodatkowe funkcje			
	Funkcja wykonywania		

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość dofinansowania – 64 680 000 zł.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.

1	litografii z importowanych plików graficznych (BMP, JPEG, GIF) i grafiki wektorowej	TAK/ NIE	
2	Konstrukcja głowicy umozliwiająca pomiar próbek bez ograniczania ich rozmiaru i wagi	TAK / NIE	
3	Konstrukcja mikroskopów umożliwiająca wymianę sondy skanującej bez konieczności justowania układu lasera (detekcyjna belka	TAK/ NIE	
4	Możliwość dokonywania pomiarów Mikroskopii sił magnetycznych, wraz z 60 sondami do trybu MFM	TAK / NIE	
		Ilość sond	Model / producent
5	Możliwość dokonywania pomiarów sił elektrostatycznych wraz z 30 sondami do trybu EFM	TAK / NIE	
		Ilość sond	Model / producent
6	Możliwość dokonywania pomiarów mikroskopii rozpływu rezystancji	TAK / NIE	
7	Stolik mikrometryczny	TAK / NIE	O przesuwie od ……. mm x ……. mm

2) Mikroskop AFM według pkt 1 a) załącznika nr 7 do SIWZ, model / producent ……..……
……..……

Detekcja ugięcia sondy wiązką lasera	TAK/ NIE	
Mikroskopia sił atomowych w trybie statycznym i rezonansowo drgającą belką	TAK/ NIE	
Zakres skanowania w kierunku XY	……. um x …….um	
Zakres skanowania w kierunku Z	…….. Um	
Układ obserwacji dźwigni AFM i powierzchni próbki		
Cyfrowa Kamera CCD pozwalająca na wyświetlanie obrazu na monitorze komputera sterującego mikroskopem	TAK/ NIE	
Podstawowe parametry komputera		
Kompatybilny komputer	Producent	Parametry

Monitor			
Klawiatura			
Myszka			
Procesor			
Dysk twardy			
Pamięć operacyjna			
Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu, zapewniające obróbkę, opracowywanie i prezentację danych pomiarowych, pracujące pod systemem Windows	Tak / Nie		

Dodatkowe funkcje			
1	Funkcja wykonywania litografii z importowanych plików graficznych (BMP, JPEG, GIF) i grafiki wektorowej	TAK/ NIE	
2	Konstrukcja głowicy umozliwiająca pomiar próbek bez ograniczania ich rozmiaru i wagi	TAK / NIE	
3	Konstrukcja mikroskopów umożliwiająca wymianę sondy skanującej bez konieczności justowania układu lasera (detekcyjna belka	TAK/ NIE	
4	Możliwość dokonywania pomiarów Mikroskopii sił magnetycznych, wraz z 60 sondami do trybu MFM	TAK / NIE	
		Ilość sond	Model / producent
5	Możliwość dokonywania pomiarów sił elektrostatycznych wraz z 30 sondami do trybu EFM	TAK / NIE	
		Ilość sond	Model / producent
6	Możliwość dokonywania pomiarów mikroskopii	TAK / NIE	

	rozpływu rezystancji		
7	Stolik mikrometryczny	TAK / NIE	O przesuwie od ……. mm x ……. mm

3) Mikroskop AFM według pkt 1 b) – model / producent: ……..……..……..……

Detekcja ugięcia sondy wiązką lasera	TAK/ NIE	
Mikroskopia sił atomowych w trybie statycznym i rezonansowo drgającą belką		
Zakres skanowania w kierunku XY	……. um x ……um	
Zakres skanowania w kierunku Z	……. Um	
Układ obserwacji dźwigni AFM i powierzchni próbki		
Cyfrowa Kamera CCD pozwalająca na wyświetlenie obrazu na monitorze komputera sterującego mikroskopem	TAK/ NIE	
Podstawowe parametry komputera		
Kompatybilny komputer	Producent / Model	Parametry
Monitor		
Klawiatura		
Myszka		
Procesor		
Dysk twardy		
Pamięć operacyjna		
Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu, zapewniające obróbkę, opracowywanie i prezentację danych pomiarowych, pracujące pod systemem Windows	TAK/ NIE	Nazwa oprogramowania
Konstrukcja mikroskopu umożliwiająca wymianę sondy skanującej bez konieczności justowania lasera	TAK / NIE	
Dodatkowe funkcje		
Funkcja wykonywania litografii z importowanych		

1	plików graficznych (BMP, JPEG, GIF) i grafiki wektorowej	TAK/ NIE	
2	Konstrukcja głowicy umożliwiająca pomiar próbek bez ograniczania ich rozmiaru i wagi	TAK / NIE	
3	Konstrukcja mikroskopów umożliwiająca wymianę sondy skanującej bez konieczności justowania układu lasera (detekcyjna belka	TAK/ NIE	
4	Możliwość dokonywania pomiarów Mikroskopii sił magnetycznych, wraz z 60 sondami do trybu MFM	TAK / NIE	
		Ilość sond	Model / producent
5	Możliwość dokonywania pomiarów sił elektrostatycznych wraz z 30 sondami do trybu EFM	TAK / NIE	
		Ilość sond	Model / producent
6	Możliwość dokonywania pomiarów mikroskopii rozpływu rezystancji	TAK / NIE	
7	Stolik mikrometryczny	TAK / NIE	O przesuwie od ……. Mm x ……. Mm

4) Mikroskop STM według pkt 1 c) załącznika nr 7 do SIWZ, model / producent ……..……
……..……..…….

	Parametr	
Głowica STM	Zakres skanowania …… x …….. nm^2 zakresie pomiarowym minimum od …. nA do …… nA	
Kontroler sterujący pomiarem	TAK/ NIE	
System do wykonywania sond ostrzy	TAK/ NIE	
Drut Pt/Ir do wykonywania sond	W ilości …….mb	
parametry komputera		
Kompatybilny komputer	Producent	Parametry
Monitor		
Klawiatura		
Myszka		

Procesor			
Dysk twardy			
Pamięć operacyjna			
Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu, zapewniające obróbkę, opracowywanie i prezentację danych pomiarowych, pracujące pod systemem Windows	Tak / Nie		
Drukarka			
- technologia druku:		-druk laserowy kolorowy	**TAK / NIE**
		- druk formatu A4	**TAK/ NIE**
- funkcja skanera:		-skaner kolorowy zgodny z TWAIN	**TAK/ NIE**
		-skanowanie z szyby ekspozycyjnej i podajnika ADF	**TAK/ NIE**
		- optyczna rozdzielczość skanowania	**…….dpi**
- podajnik:		- podstawowy	**……arkuszy**
		- ADF	**…….arkuszy**
wydajność		- średnia wydajność wkładów przy wydruku standardowej strony w druku ciągłym i przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta drukarki: wg normy ISO/IEC 24712 lub IEC 19798 w trzech kolorach	**……stron**
- szybkość druku:		W trybie draft	- ……. stron A4 / minutę dla czerni - …… stron A4 / minutę dla koloru
- pamięć RAM:		……..MB	

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość dofinansowania – 64 680 000 zł.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.

- inne:		- w zestawie z drukarką zestaw tonerów startowych oraz **dodatkowy komplet tonerów, błękitny, purpurowy, żółty, czarny, umożliwiający wydruk - wg normy ISO/IEC 24712 lub IEC 19798 minimum 1400 stron w kolorze.**	**TAK/ NIE**
Dodatkowe funkcje			
1	Głowica mikroskopu STM do pomiaru małych prądów tunelowych o zakresie pomiarowym	od…… do……..	
2	Stolik mikrometryczny	TAK / NIE	O przesuwie od ……. mm x ……. mm

5) Kompatybilne Akcesoria

akcesoria	Model/ parametr	Producent
2 próbki wzorcowe		
Aktywny stolik antywibracyjny		
Pasywny stolik antywibracyjny		
Pasywny stolik antywibracyjny		
Pasywny stolik antywibracyjny		
1) Komputer przenośny	1)	
Procesor		
Dysk twardy		
Pamięć operacyjna		
2) Oprogramowanie komputera przenośnego	2)	

…….
(podpis Wykonawcy